

△の数		訂正記事			担 当	検 図	年 月 日		△の数		訂正記事			担 当	検 図	年 月 日	
△									△								
△									△								
適 用 規 格																	
定 格	使用温度範囲		-55℃ ～ +105℃ (注1)					保存温度範囲		-10℃ ～ +60℃ (注3)							
	使用湿度範囲		20% ～ 80% (注2)					保存湿度範囲		40% ～ 70% (注3)							
	適合コネクタ		DF51K-*(D)S-2C(###)					電 圧		250V AC/DC							
	適合電線		AWG#30					電 流	AWG 30 : 0.5A								
	被覆外径		φ0.8 mm														
性 能																	
項 目			試 験 方 法					規 格					QT	AT			
構造																	
外観,構造,仕上げ			目視, 寸法測定器にて測定する。					図面と合致していること。					○	○			
表示			目視にて確認する。										○	○			
電気的性能																	
低電圧、低電流下の接触抵抗			20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。					30 mΩ 以下					○	-			
機械的性能																	
繰り返し動作 (Snメッキ)			30 回の抜き差しを行う。					①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。					○	-			
繰り返し動作 (Auメッキ)			50 回の抜き差しを行う。					①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。					○	-			
耐振性			周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。					①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。					○	-			
耐衝撃性			加速度 490 m/s2、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。										○	-			
環境的性能																	
定常状態の耐湿性			温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)					①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。					○	-			
温度サイクル			温度 -55 → 105℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)					①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。					○	-			
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。																	
							製 図	担 当	検 図	承 認	リリース						
							KIM. Y. H	KIM. Y. H	LIM. S. M	LIM. S. M	ENG 20.02.13 DEPT						
							18.10.02	18.10.02	18.10.02	18.10.02							
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。いる。																	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目																	
HIROSE KOREA CO.,LTD.					製 品 規 格 表					製品名 DF51K-30SC (800)							
コード NO.(OLD)				図番.				製品コード				1					
CL				JLC4-611514				CL 6652-0067-0-800				1					